## УДК 537.226.4 ДИСПЕРСИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК P(VDF-TRFE) С ВКЛЮЧЕНИЯМИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ И ЖЕЛЕЗА

## **Г.К. Шмелев, А.А. Богомолов, А.В. Солнышкин, И.М. Морсаков** Тверской государственный университет, Тверь, Россия

Исследованы диэлектрические свойства композиционных полимерных пленок на основе сополимера поливинилиденфторидаполитрифторэтилена (P(VDF-TrFE)) с включениями керамических сегнетоэлектриков цирконата титаната бария свинца (ЦТБС), цирконата титаната свинца (ЦТС) и железа (Fe). Введение в полимерную матрицу включений керамики увеличивает диэлектрическую проницаемость (є) композита, тогда как наличие частиц железа ее уменьшает. Получена зависимость величины є от объемного содержания керамического наполнителя и выполнен ее анализ на основе модели Пуна-Шина. *Ключевые слова: диэлектрическая дисперсия, сополимер P(VDF-TrFE), композит, сегнетоэлектрическая керамика* 

1. Введение. Полярные материалы, обладающие пьезоэлектрическими, пироэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами, широко используются в качестве функциональных элементов различных электротехнических устройств в современной электронике. Поэтому в последнее время наиболее актуальным является направление по получению материалов, обладающих свойствами полимеров и классических сегнетоэлектриков. Такими объектами являются композиционные пленки на основе полимерных материалов с добавлением сегнетоэлектриков, например титаната-цирконата бариясвинца (ЦТБС).

Целью настоящей работы являлось исследование диэлектрических характеристик пленок сополимера P(VDF-TrFE) и композитных пленок на его основе с различным процентным содержанием керамических сегнетоэлектриков ЦТБС-3, ЦТС-19 и включений железа, а также изучение структуры поверхности образцов методами атомной и магнитной силовой микроскопии.

**2.** Методика. Для приготовления пленочных образцов сополимера P(VDF-TrFE) использован метод кристаллизации из раствора. Получены пленочные образцы сополимера P(VDF-TrFE) с 30% содержанием трифторэтилена, толщины которых варьировалась в пределах (10 ÷ 20) мкм. Степень кристалличности пленок, определенная методом ИК-спектроскопии поглощения, составляла 40 – 50 %. Тот же самый метод изготовления был использован для создания композитных

# Вестник ТвГУ. Серия "Физика". 2014. № 2

полимерных пленок, содержащих керамические включения. Полученные композитные образцы содержали от 10 до 50 объемных процентов вышеуказанных кристаллических сегнетоэлектриков. Их толщина варьировалась в пределах (20÷100) мкм в зависимости от процентного содержания наполнителя. Исследования поверхности изучаемых образцов проводились с помощью атомного силового микроскопа Solver P47-SPM-MDT(NT-MDT).

Для исследования дисперсионных зависимостей диэлектрических характеристик в частотном интервале (10<sup>3</sup> ÷ 10<sup>6</sup>) Гц использован метод, основанный на измерениях (с помощью фазочувствительных приборов) действительной и мнимой частей полного переменного тока, проходящего через исследуемый объект.

3. Результаты и их обсуждение. Исследования, проведенные атомной силовой микроскопии методом (ACM), показали существование в образцах композита двух структур, которые на топографическом изображении поверхности (рис. 1, а) имеют разный контраст. Темная область на полученном изображении относится к аморфному состоянию сополимера. Данная аморфная структура принадлежит неполярной α-фазе с хаотичным расположением полимерных цепочек. На АСМ изображении поверхности исследуемых пленок (рис. 1, а) хорошо различимы светлые области, которые соответствуют кристаллической фракции сополимера [2,3]. Кристаллическая структура представляет собой ламелярные кристаллы, относящиеся к полярной в-фазе. Наличие кристаллической фракции обусловливает существование сополимера сегнетоэлектрических свойств.

Методом магнитной силовой микроскопии (МСМ) выполнены исследования композита P(VDF-TrFE)+20%(ЦТС-19+Fe) для регистрации включений железа. С использованием магнитного кантилевера получено изображение поверхности с учетом фазы (рис. 1, б). Отчетливо видны магнитные включения, размер которых составляет ~50 нм.

По вышеописанной методике проведены исследования диэлектрических характеристик композита P(VDF-TrFE) с микровключениями керамического сегнетоэлектрика ЦТС-19 и железа, а также образцов с различным процентным содержанием керамики ЦТБС-3. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости представлены на рис.2.



Р и с. 1. Топографическое изображение поверхности пленки P(VDF-TrFE) +20%(ЦТС-19+Fe), полученное методами: (а) – АСМ (2х2 мкм), (б) – МСМ с учетом магнитной фазы (1х1 мкм)



Р и с. 2. Частотные зависимости вещественных компонент ( $\epsilon'$ ) диэлектрической проницаемости композитов: а – P(VDF-TrFE) - кривая 1, P(VDF-TrFE)+20% (ЦТС-19+Fe) - кривая 2 и P(VDF-TrFE)+20% ЦТС-19 кривая 3; б – с различным процентным содержанием керамики ЦТБС-3: кривая 1 - 0%, 2 - 10, 3 - 20, 4 - 30, 5 - 40, 6 - 50

Как видно из рис. 2 а, для образца P(VDF-TrFE), не содержащего включений, величина вещественной компоненты диэлектрической проницаемости практически не зависит от частоты переменного электрического поля в интервале от 2 кГц до 1 МГц и составляет

примерно  $\varepsilon = 12$ . Введение в образец P(VDF-TrFE) включений керамики ЦТС-19, составляющих 20% объема композита P(VDF-TrFE), оказывает значительное влияние на величины действительной и мнимой компонент диэлектрической проницаемости – они возрастают в исследуемом диапазоне частот приблизительно в 3 раза. Образец, содержавший включения керамики ЦТС-19 и одновременно железа, промежуточное показывает значение между величинами диэлектрической проницаемости для чистого образца и содержащего включения одной керамики ЦТС-19. Таким образом, можно сделать вывод о том, что включения железа частично компенсируют увеличение диэлектрической проницаемости при введении керамики. Необходимо также отметить, что в образцах P(VDF-TrFE)+20% ЦТС-19 и P(VDF-TrFE)+20% (ЦТС-19+Fe), в отличие от пленок P(VDF-TrFE) без включений, появляется наклон частотной зависимости диэлектрической проницаемости.

Частотные зависимости диэлектрической проницаемости образцов, содержащих включения сегнетоэлектрической керамики ЦТБС-3 представлены на рис. 2 б. Как и в предыдущем случае, наличие керамического наполнителя приводит к увеличению  $\varepsilon$ . Причем с ростом процентного содержания керамики ЦТБС-3 в композите значение  $\varepsilon$  увеличивается. Также можно отметить дисперсии диэлектрических характеристик в области частот ( $10^4 \div 10^6$ ) Гц.

Согласно модели Пуна-Шина [1] рассчитана зависимость вещественной компоненты диэлектрической проницаемости от процентного содержания входящей в композит P(VDF-TrFE) керамики ЦТБС:

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_m} = 1 + \frac{\phi\left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_m} - 1\right)}{\phi + \frac{1}{3}\left(1 - \phi\right)\left[\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_m}\left(1 - \phi\right) + \phi + 2\right]},$$
(1)

где  $\varepsilon_m$  – диэлектрическая проницаемость матрицы ( $\varepsilon_m = 12$ ),  $\varepsilon_i$  – диэлектрическая проницаемость включений (для ЦТБС  $\varepsilon_i = 2050$ ),  $\varepsilon$  - диэлектрическая проницаемость композита,  $\phi$  - объемная фракция керамики (от 0 до 0,5).

Для сравнения теоретически рассчитанной и экспериментально полученной зависимостей диэлектрической проницаемости от процентного содержания ф входящей в композит P(VDF-TrFE) керамики ЦТБС построены соотверствующие графику (рис. 3). Как видно из представленных результатов, согласие с теорией [1] наблюдается лишь для малых концентраций керамики ЦТБС (до 20%). При бо́льших концентрациях керамики ЦТБС возникает отклонение теоретически рассчитанной и экспериментально полученной зависимостей, которое при максимальной концентрации включений достигает двух раз.



Р и с. 3. Концентрационные зависимости вещественных компонент диэлектрических проницаемостей (ε'), полученных экспериментально для композита P(VDF-TrFE)+ЦТБС-3 (экспериментальные точки 1) и рассчитанных по формуле (1) (кривая 2). Частота измерительного поля 2 кГц. φ – объемный процент керамики (от 0 до 50 %)

4. Заключение. В ходе проведенных исследований установлено, что присутствие сегнетоэлектрической керамики в полимерной матрице P(VDF-TrFE) оказывает значительное влияние на диэлектрические свойства композита, а именно, увеличение содержания керамического наполнителя приводит к росту є. Наличие включений железа в системе Р(VDF-TrFE)+ЦТС-19 вызывает ee уменьшение. В результате сравнительного обнаружено анализа показано расхождение рассчитанной теоретически по формуле (1)зависимости диэлектрической проницаемости и экспериментально наблюдаемой. Это имеет место при концентрациях керамики ЦТБС-3 в композите P(VDF-TrFE)+ЦТБС-3 от 30 до 50 %. Для надежной интерпретации экспериментальных данных необходимо построение корректных схем расчетов эффективных констант композитов, что также может служить основой целенаправленного поиска новых материалов с наперед заданными свойствами [4].

#### Список литературы

- Poon Y. M., Shin F. G. A simple explicit formula for the effective dielectric constant of binary 0-3 composites // J. Mat. Sci. 2004. V.39. P.1277.
- 2. El Hami1 K., Yamada H. Matsushige K. Nanoscopic measurements of the electrostriction responses in P(VDF/TrFE) ultra-thin-film copolymer using atomic force microscopy // Appl. Phys. A. 2001. V.72. P.347.
- Park Y.J., Kang S.J., Parka C., Kim K.J., Lee H.S., Lee M.S. U-In Chung, Park I.J. Irreversible extinction of ferroelectric polarization in P(VDF-TrFE) thin films upon melting and recrystallization // Appl. Phys. Lett. 2006. V.88. 242908.
- 4. Чернобабов А. И. Физические свойства гетерогенных сегнетоэлектрических систем: Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук. Ростов-на-Дону., 2008.

# DIELECTRIC DISPERSION IN COMPOSITES ON THE BASE OF COPOLYMER P(VDF-TRFE) FILMS COMPRISING FERROELECTRIC CERAMICS AND FE INCLUSIONS ©

G.K. Shmelev, A.A. Bogomolov, A.V. Solnyshkin, I.M. Morsakov Tver State University, Tver,

Dielectric properties of composite films on the base of copolymer P(VDF-TrFE) films comprising inclusions of ferroelectric ceramics zirconate titanate barium lead (BPZT), zirconate titanate lead (PZT) and iron were studied. Introducing the ceramics inclusions increase dielectric permittivity ( $\epsilon$ ) of the composite, at the same time Fe inclusions decrease value of  $\epsilon$  in P(VDF-TrFE)+20%PZT+Fe composite. It was found a dependence of dielectric constant on volume fraction of ceramics filler and carried out its analysis on the base of Poon – Shin model.

*Keywords: dielectric dispersion, copolymer P(VDF-TrFE), composite, ferroelectric ceramics* 

### Об авторах:

СОЛНЫШКИН Александр Валентинович - профессор физикотехнического факультета ТвГУ, г.Тверь.

БОГОМОЛОВ Алексей Алексеевич – профессор физикотехнического факультета ТвГУ, г.Тверь.

ШМЕЛЕВ Григорий Константинович – магистр физикотехнического факультета ТвГУ, г.Тверь.

МОРСАКОВ Иван Михайлович - инженер физико-технического факультета ТвГУ, г.Тверь.